

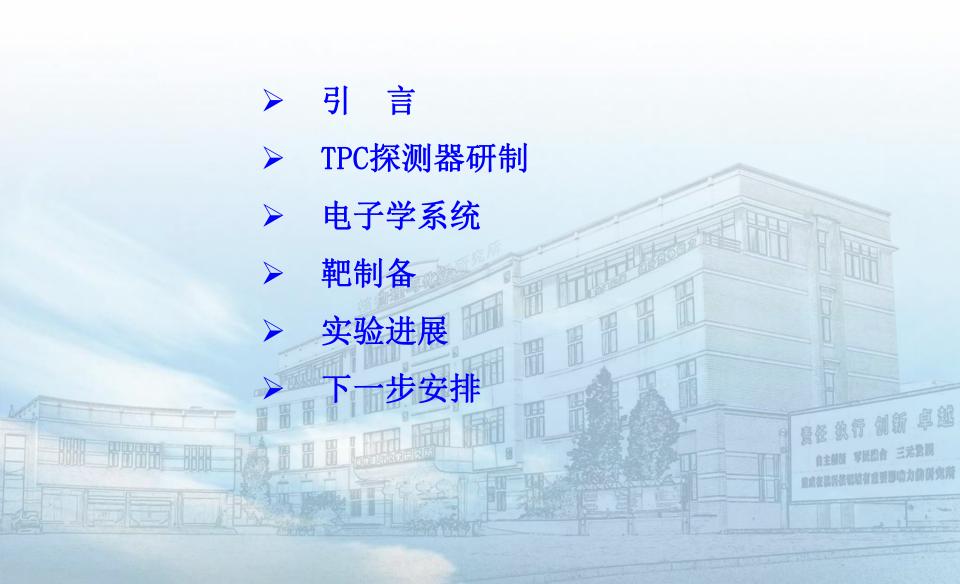


高精度裂变截面测量用TPC 探测器研制及实验进展





見 录

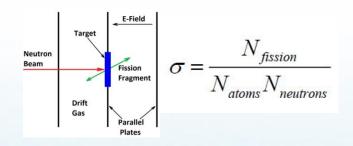


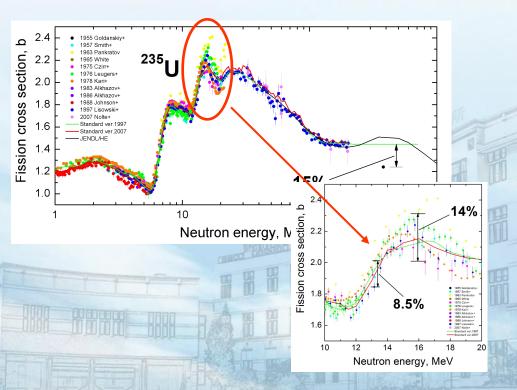


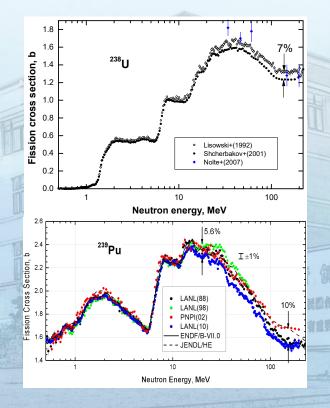
核反应堆、核素合成等领域对快中子区域的核参数非常敏感, 对裂变截面等参数的精度有较高的要求,在反应堆系统设计中通过 高精度的模拟软件对系统进行评估,而核数据的精度对模拟结果有 较大的影响。反应截面不确定度对这些领域的影响已经有了详细的 研究,结果表明,反应截面的不确定度要达到1%及以下。

LANL的Todd Bredeweg, Carol Burns等人在2013年9月13日的报告《武器科学计划与核物理集成》中就明确指出: 裂变截面是中子源项的重要部分,期望²³⁹Pu和²³⁵U的裂变截面测量水平可以达到2% (2σ)的水平,并要求改进对当前一些重要核素截面数据的评估。

²³⁵U, ²³⁸U, ²³⁹Pu中子诱发裂变截面(入射中子能量100keV~14MeV)在过去50年使用裂变室进行过多次测量,其不确定度在3%~5%,其固有的不确定度使其很难达到更高精度。









裂变室法截面测量不确定度的主要来源:

- 1、裂变碎片和α粒子及其他带电粒子甄别(1%)
- 2、靶核子数及分布(1.5%)
- 3、中子束流分布(0.7%)
- 4、相对测量时参考靶的截面不确定度(1%)

必须选择新的测量方法:

更好的粒子甄别能力;

可以获得中子和靶核数及分布;

更低不确定度的参考靶。

电子的漂移路径 带电粒子径迹 高压电极 微单元结构 读出探测器

因此,提出了以H作为参考靶的TPC测量方法。



TPC (Time Projection Chamber,时间投影室)测量方法的优点:

- ▶ 更好的粒子甄别(可以测量粒子的能量和径迹);
- 》 可测量靶核和中子的分布(位置分辨约百μm);
- ▶ 可使用H(n, n)截面(0.2%)作为标准截面(测量动态范围大)。

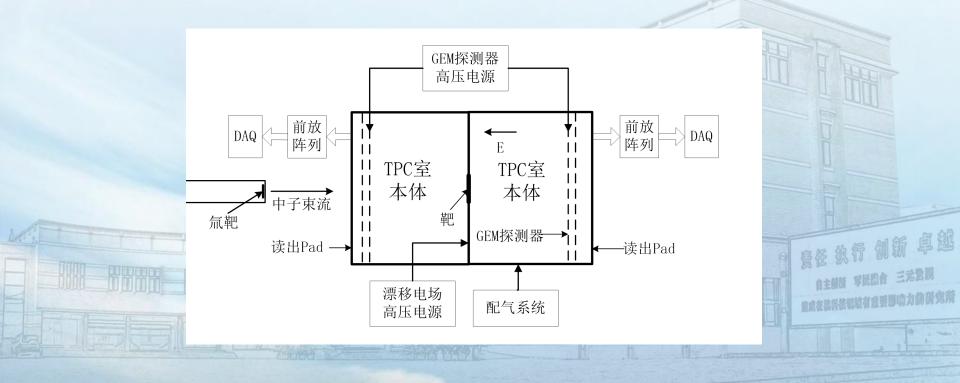


量任效行 创新 卓越



测量原理

对于裂变TPC,待测量的核素靶片放置于TPC的中心,入射中子与样品发生反应,裂变碎片、α粒子、质子等通过径迹和能量进行粒子甄别。同时可进行靶和束流的不一致性测量。



测量原理

利用裂变TPC(Time Projection Chamber)探测系统测量裂变

截面时:

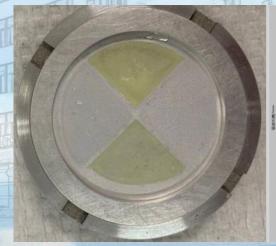
$$\frac{\sigma_x}{\sigma_H} = \frac{\varepsilon_H}{\varepsilon_x} \cdot \frac{\Phi_H}{\Phi_x} \cdot \frac{N_H}{N_x} \cdot \frac{\sum_{XY} (\Phi_{H,i} \cdot n_{H,i})}{\sum_{XY} (\Phi_{x,i} \cdot n_{x,i})} \cdot \frac{\omega_x}{\omega_H} \cdot \frac{C_x}{C_H}$$

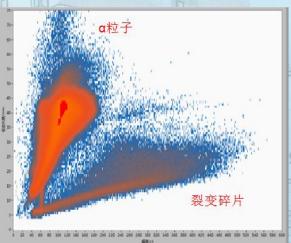
 σ —裂变截面; ϵ —探测效率; Φ —中子通量; N—靶核数;

 ϕ —不同位置靶核子数; n—不同位置中子通量; ω —死时间修正; C—反应数

需要测量的主要物理量:

- ▶中子通量及分布
- ▶靶核数及分布
- > 裂变事件数



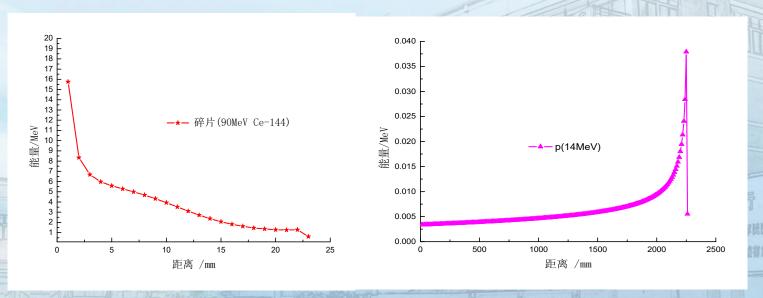




带来的问题

1、超大的动态范围

在1atm下,14MeV的质子、10MeV的α粒子和裂变碎片(选择Ce-144,80MeV)在P10工作气体中,最小能损为3.4keV/mm(14MeV质子),最大能损约14MeV/mm(80MeV的Ce-144碎片),其动态范围约4000倍。



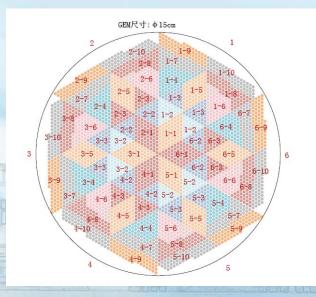


带来的问题

2、高密度的电子学系统

Pad尺寸为2mm的正六边形,覆盖整个α粒子径迹情况下,单面约4600路,双面总规模约9200路。

对电子学的要求:前放集成度高、功耗小(10mW)、动态范围大(>2000:1)、噪声小、可波形保持;数采电路采样精度14bit,采样率不低于50MCPS。







带来的问题

3、超薄底衬的分区靶

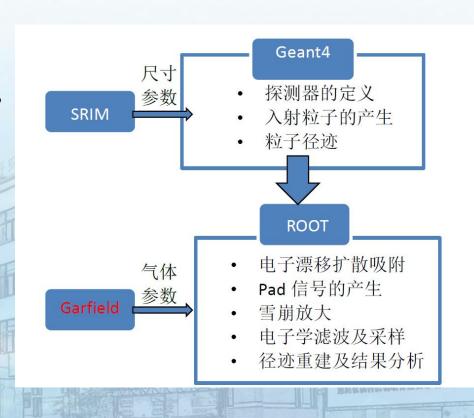
在直径30mm的区域镀上U-235、U-238、Pu-239和含氢材料。靶底衬厚度不大于1μm。





1、模拟计算

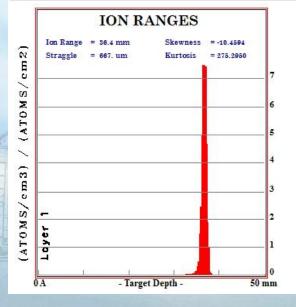
对探测器进行了全模拟。 使用 Geant4 软件完成探测器结构的绘制, 粒子的产生及其在工作气体中沉积能量, 产生径迹;使用ROOT软件完成电子 在气体的漂移、扩散、吸附、在读出 pad 上产生信号,对信号滤波成型和采 样量化,对径迹进行重建及结果分析。 其中SRIM 软件模拟给出探测器尺寸, Garfield 模拟给出气体的参数信息,包 括漂移速度、扩散及吸附系数。

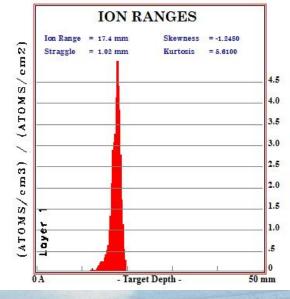


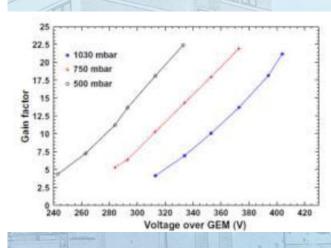


粒子的产生与初 级电离	模拟用的物理包	QGSP_BIC_HP
	电离室尺寸	Ф 150mm×65mm
	粒子产生位置	漂移极正中心
	裂变碎片粒子类型与数目	基于 U-235 裂变核分布抽样
	裂变碎片粒子能量	轻核: 0-100MeV 平均分布 重核: 0-70MeV 平均分布
	Alpha 粒子数目	与裂变碎片产生概率一致
	Alpha 粒子能量	在 0-5MeV 内平均分布
	单次产生的粒子数	1 个 (设定裂变碎片和 alpha 粒子 的产生概率相同)
气体属性与次级 电离	工作气体	Ar: CH ₄ (90:10)
	气压	1 atm
	平均电离能	28eV
	漂移电场	130V/cm

	漂移速度	5.45172cm/us
	吸附系数	0.0014379cm ⁻¹
	横向扩散系数	$0.060492 \mathrm{cm}/\sqrt{cm}$
	纵向扩散系数	0.036227 cm/ \sqrt{cm}
信号读出与重建 -	读出 pad 尺寸	边对边 2mm 的六边形,
	pad 时间信息	pad 电子的平均漂移时间
	pad 能量信息	pad 电子数
	pad 电流信息	某时刻 pad 与 GEM 膜之间的电子数
	pad 与 GEM 之间的距离	1mm





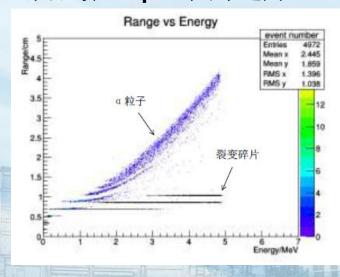


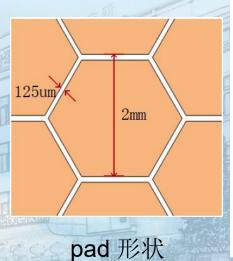


2、读出探测器

粒子出射角度各向同性,pad 形状采用六边形,保证每个pad 形状相同。模拟了四种pad 尺寸(1mm、2mm、3mm、4mm)的甄别效果。碎片能量与α粒子的能量均为0~5MeV 均匀分布,同时裂变碎片的能量要小于5MeV需要在靶内损失足够的能量,此时裂变碎片的方向应该接近与靶平面平行。pad 尺寸越小,甄别效果越好,pad 为1mm 时使得读出密度过大,为工程实现带来困难。

综合考虑,pad 尺寸选为2mm。





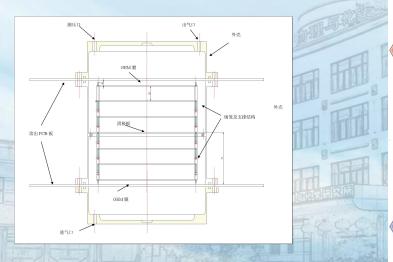
pad 为2mm 时模拟计算的甄别效果

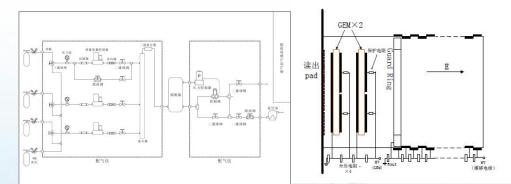
pad 分布



3、整体设计

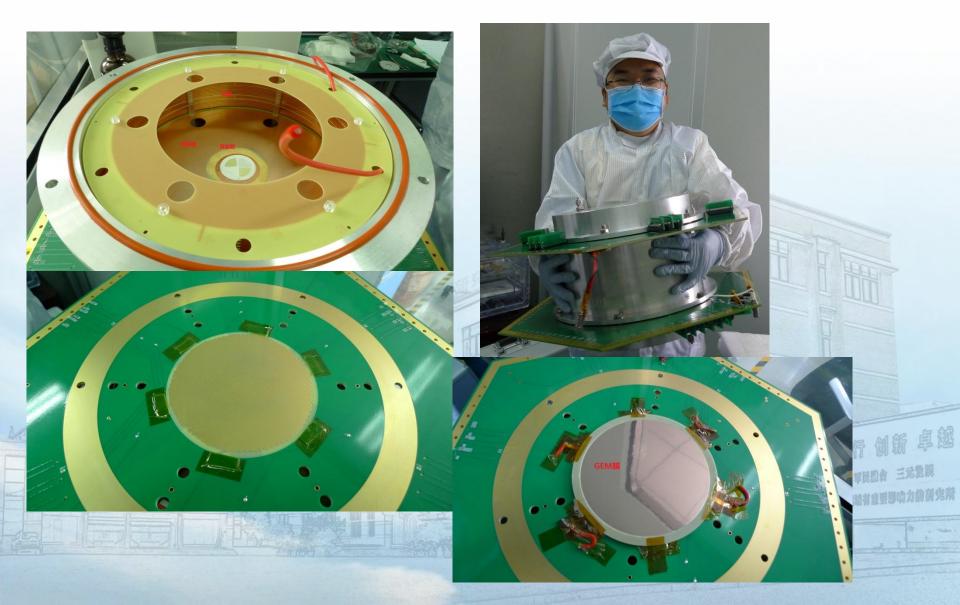
对TPC探测器的机械结构、读出探测器、供气系统、GEM和场笼的供电等进行了整体设计,研制了用于高精度裂变截面的TPC探测器。





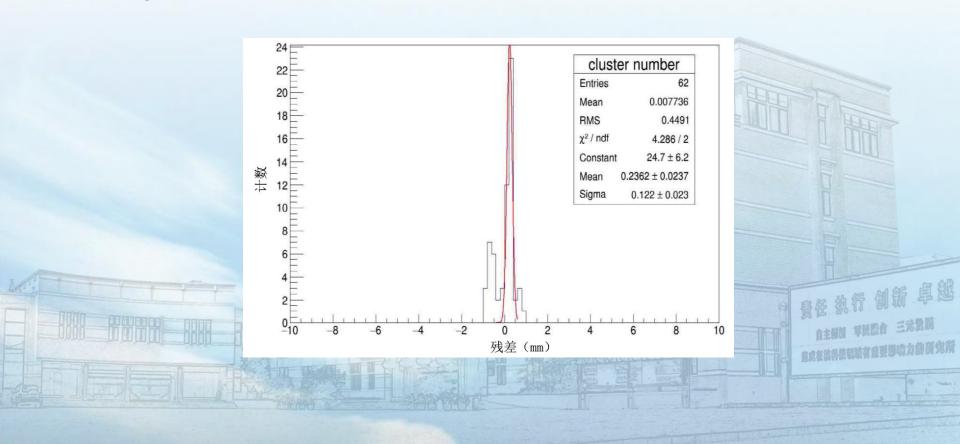








使用²⁴¹Am源的alpha粒子测定了系统的位置分辨,当GEM电压为300V时,xy平面的残差分布如下图,高斯拟合结果为σ=122μm,即xy平面的位置分辨为122μm。

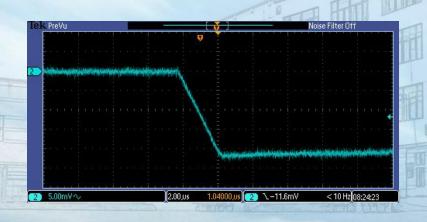


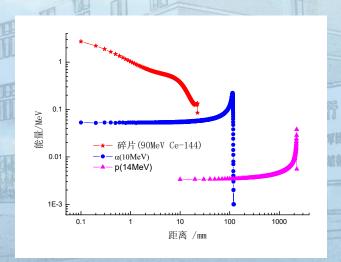


1、技术指标要求

在1atm下,14MeV的质子、10MeV的α粒子和裂变碎片(选择Ce-144,90MeV)在P10工作气体中,最小能损为3.4keV/mm(14MeV质子),最大能损约14MeV/mm(90MeV的Ce-144碎片),其动态范围约4000倍。考虑到大能量碎片可以通过能量进行粒子甄别,可适当降低电子学系统动态范围,因此提出2000: 1的动态范围。

不同出射方向的粒子,其脉冲宽度表征Z方向的径迹长度,因此需要进行波形采集。 电子漂移速度约为5cm/µs,因此采样率最低50MCPS可满足采样需求。

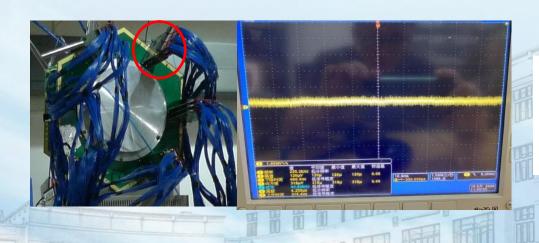


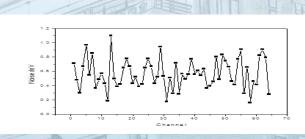




2、前放性能测试

对TPC探测器的ASIC前放进行了性能测试,其噪声水平约0.15fC@1pC(对应噪声电压 0.3mV),动态范围约6000:1。加上数采电路后,噪声约0.6mV,动态范围约3000:1。功耗约10mW/Ch,不需要制冷。





电子学噪声



参数	值
极性	负
通道数	64
输入动态范围	50fC, 100fC, 500fC, 1000fC
增益	2mV/fC,4mV/fC,20mV/fC, 40mV/fC
成型时间	80ns, 160ns, 240ns, 320ns
差分输出电压	2V _{p-p}
共模电压	0.9V
功耗	10mV/Ch
成形时间	80ns, 160ns, 240ns, 320ns
电子学噪声	2000e@1pC

責任執行 创新 卓越

3、数采电路

电子学系统

数采电路总通道数约9200路,采样率50MCPS,采样位数14位。

系统从硬件角度可分为两部分,前端数据采集和后端控制接收。前端数采使用标准 6U机箱,数据发送卡用于同步触发信号的输入和数据的输出。每张数采卡共有128对差分信号输入,数采卡与发送卡间通过高速背板通讯,实现数据交换和命令控制。数据发送卡兼顾接收外部触发、时钟、同步信号的接收和分发工作。

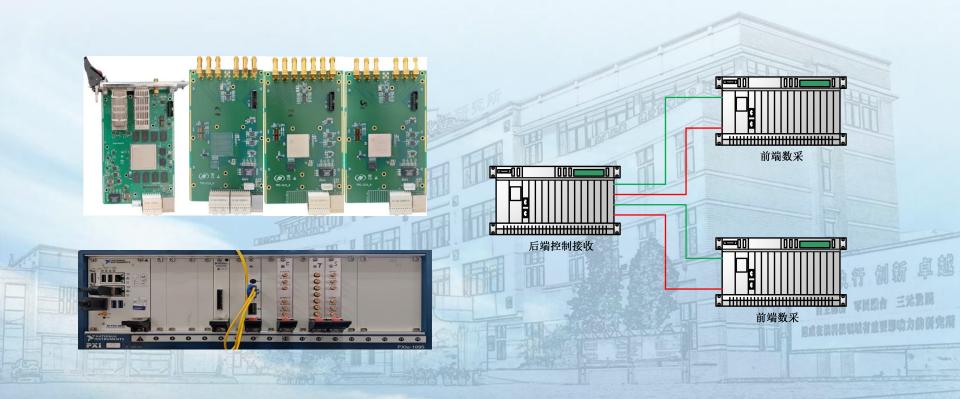




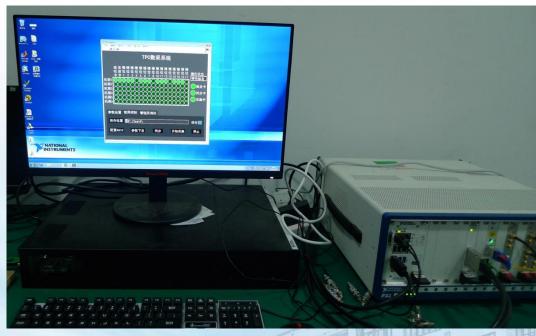


3、数采电路

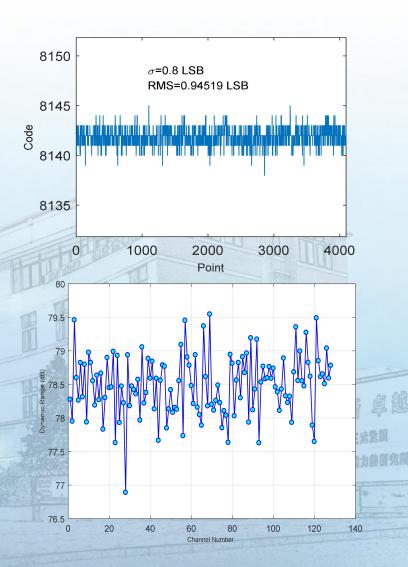
后端控制接收机箱使用NI PXIe-1095标准机箱,机箱内插接有时钟卡、同步卡、触发卡、数据接收卡和存储控制器。









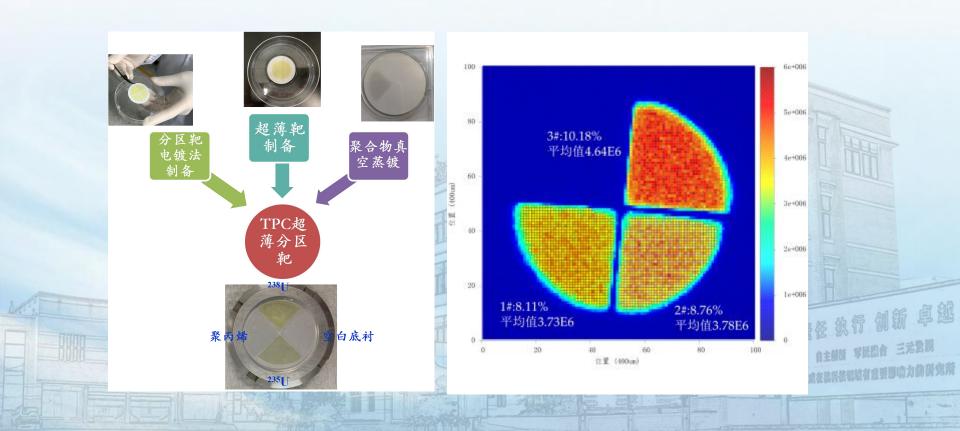




实验用靶制备

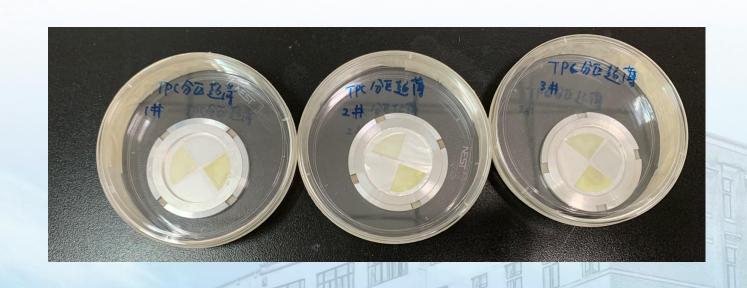
全电镀工艺的多元素靶件制备工作包含模拟计算、特种电镀装置的设计与加工以及工艺研究。

国内首次完成TPC超薄分区靶件的制备,镀层不均匀性达到8%左右。





实验用靶制备

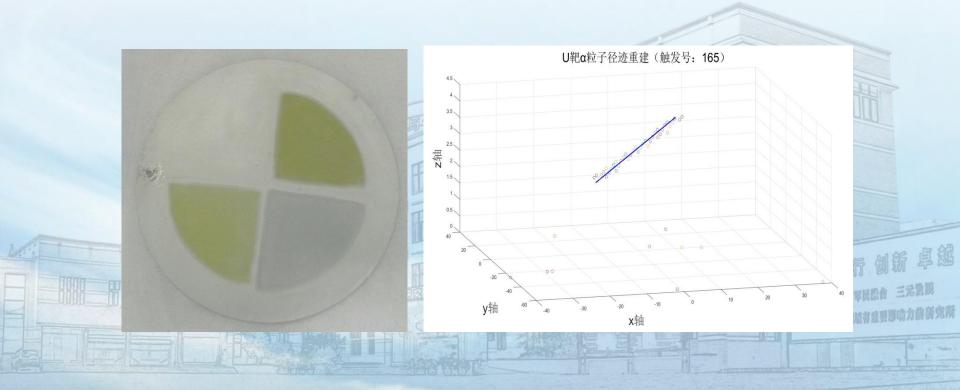


超薄分区靶,含²³⁵U、²³⁸U和含氢材料 (硬脂酸甘油酯)

景任教行 创新 卓越

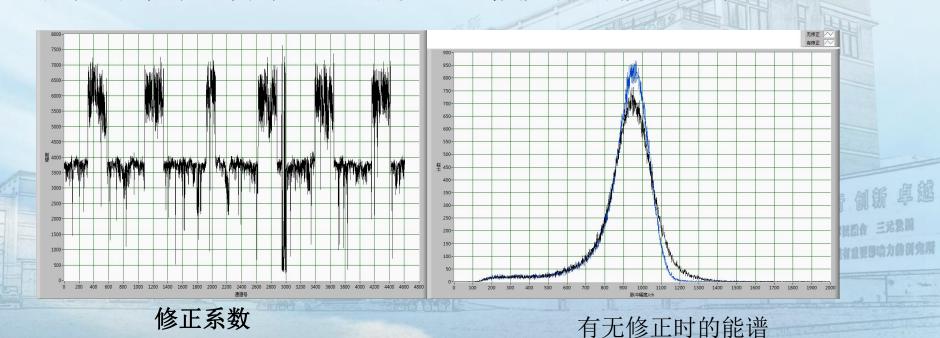


将实验用靶(U靶)放置于TPC探测器阴极,测量α粒子信号,通过准确的同位素丰度获取需要的靶核数。同时,根据α粒子的径迹起点,得出α粒子的二维位置分布,既靶核的二维位置分布。



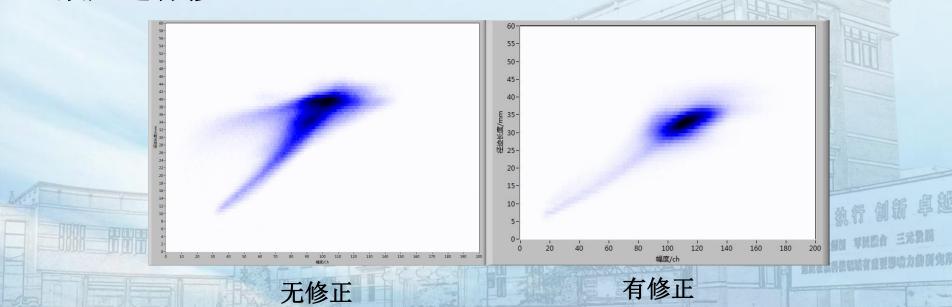


在径迹重建时,发现α粒子径迹上的部分pad的信号幅度异常,经分析认为是ASIC前放的增益不一致引起的,因此将信号发生器的输出信号分为64通道,每通道连接2pf的电容,给每张板子的所有通道注入电荷,通过数采系统进行信号采集,并获取脉冲波形的幅度作为修正系数。



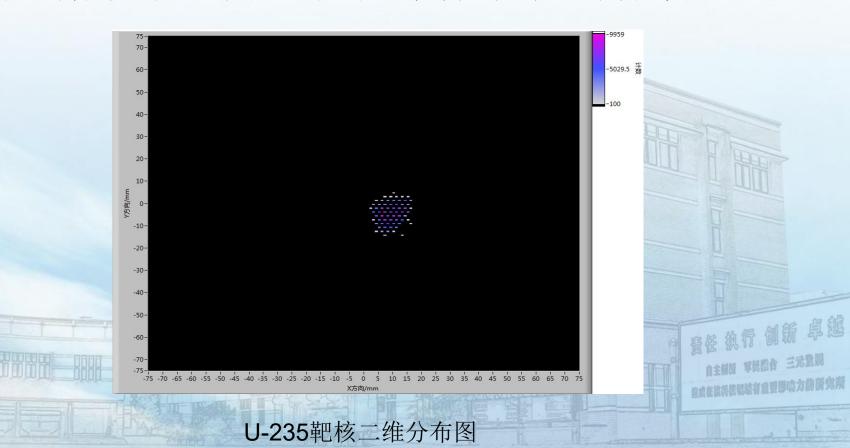


当α粒子垂直于pad 的方向入射时,由于投影面积很小,读出的pad 数较少,使得径迹的重建比较困难,难以准确的重建粒子的径迹。为了获得准确的α粒子数,同时提高裂变碎片与α粒子甄别的效果,使用信号的弹道亏损效应进行修正。





对数据进行了预处理,得到带电粒子径迹起点的pad编号,将其进行二维位置统计,获得α粒子二维分布图。





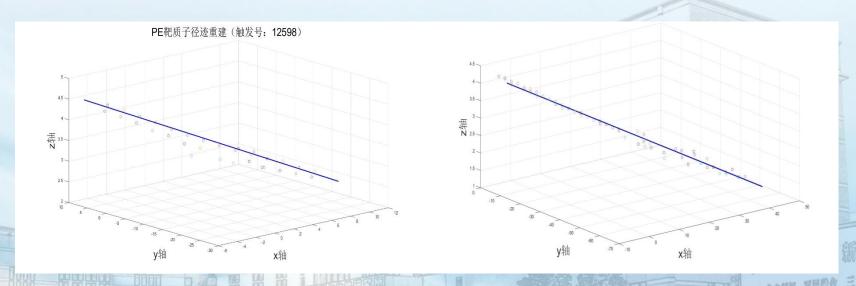
实验进展-质子数及分布测量

使用两片厚度约8µm的铝箔将高纯聚乙烯膜(半径约15cm的1/4圆)夹在中间,铝箔用压环固定,将压环固定于TPC探测器内阴极板上。将TPC探测器移至PD300大厅,放置于束线II的0°角方向,阴极板中心位置距离氘靶约30cm。



实验进展-质子数及分布测量

使用Ar(90%)+CF $_4$ (10%),气压100kPa。使用DD中子源进行质子测量。从径迹的起点和长度推测,径迹为质子或宇宙射线。



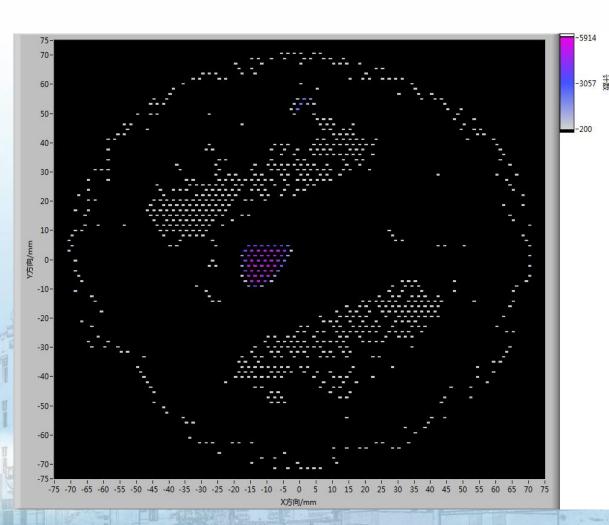
质子径迹

宇宙射线径迹



实验进展-质子数及分布测量

中心偏左下部位有一高计数区间,接近1/4圆,此处与放置PE膜位置重合,为PE膜上出射质子的径迹起点。在直径约150mm的圆上近似一圈的径迹起点为阴极外围PCB板(阴极板为PCB板,中间为直径150mm的铝板)上的H与入射中子反应生成的质子。其余部位为宇宙射线引起的径迹。

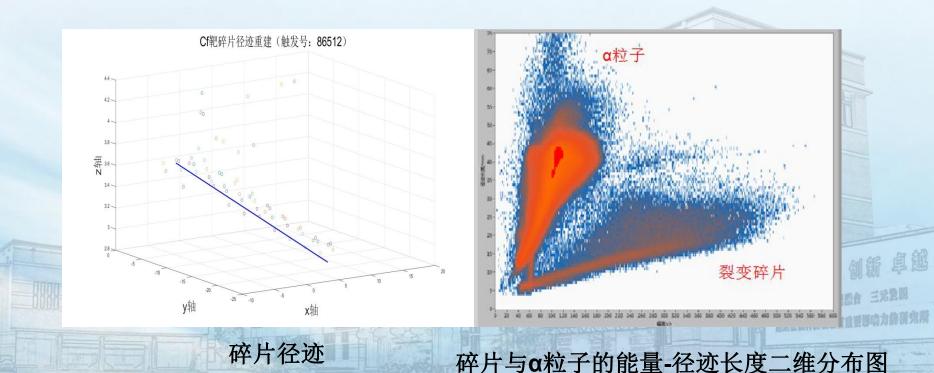


质子靶核二维分布图



实验进展-能量-长度二维分布

将Cf-252镀片置于TPC探测器阴极中心,进行裂变碎片与 α粒子甄别实验。使用P10气体气压控制在100kPa。





下一步安排

> 探测系统性能优化

- 1. 改变阴极板结构和信号引出方式,提高信噪比,为下一步白光源上提取时间信号做准备;
- 2. 增加电磁屏蔽外壳,降低干扰;
- 3. 将阴极输出、GEM输出信号通过差分前放送入数采系统进行脉冲幅度采集,替代pad信号进行总脉冲幅度测量,提高能量分辨。

> 实验测量

在白光源上进行快中子能区(100keV~20MeV)U、Pu的高精度裂变截面测量。

> 数据分析

- 1. 优化径迹重建程序,准确获取粒子径迹长度、dE/dx和起点;
- 2. 不确定度的分析。

